

**Renishaw va lancer son nouveau palpeur de lumière structurée sans contact pour le système multicapteur REVO®**

Renishaw a le plaisir d'annoncer le lancement du nouveau palpeur de franges RFP pour le système REVO de mesure 5 axes sur machines à mesurer tridimensionnelles (MMT).

Le palpeur RFP augmente la capacité multi-capteurs du système REVO en ajoutant un contrôle de lumière structurée sans contact à la gamme de produits existants, qui offre maintenant cinq familles de palpeurs différentes, chacune étant conçue spécifiquement pour maximiser les avantages du mouvement 5 axes et du positionnement infini. Tous les palpeurs du système REVO peuvent être modifiés automatiquement et comprennent des palpeurs de scanning tactile, à déclenchement par contact, de finition de surface, de lumière structurée sans contact et de vision. Tous sont utilisés dans un cadre de référence de coordonnées commun et fournissent le choix d'un outil optimal pour mesurer plusieurs entités sur une même plate-forme MMT.

Le RFP projette un motif de franges sur la surface de la pièce et la caméra du palpeur capte la variation du motif de franges pour construire un nuage de points avec les données de surface 3D. Le nuage de données est ensuite évalué par le logiciel de métrologie 3D pour fournir les résultats du contrôle et la carte thermique de la pièce. Le contrôle de lumière structurée sans contact avec le RFP offre des avantages évidents par rapport aux techniques de palpage tactile traditionnelles pour les surfaces de forme libre et de géométrie complexe, telles que des pièces fabriquées de façon additive, des disques à aubes et lames de l'aérospatiale, des chambres de combustion de culasse de moteur automobile et des surfaces délicates non adaptées à la mesure tactile.

Contrairement à d'autres systèmes de lumière structurée sans contact, le palpeur de franges RFP ne nécessite pas de marqueurs de référence pour assembler des données de différentes zones, comme cela s’effectue automatiquement par le système REVO. Le revêtement de la pièce avec une substance mate est également non nécessaire grâce à la compensation d'exposition automatique de différentes couleurs de surface, de textures et de réflexivité, assurant des résultats de données optimaux.

Deux nouveaux outils logiciels permettent une numérisation et une planification de contrôle facile à utiliser. Le planificateur de contrôle RFP est un outil de planification de trajectoire et de génération de programmes pièce DMIS à partir de la CAO, tandis que l'application de numérisation RFP guide les utilisateurs autour des pièces sans modèles, en collectant des données dans le cadre d'un processus de rétro-ingénierie.

Le palpeur RFP est interchangeable de façon répétée et automatique avec toutes les autres options de palpeur disponibles pour le système REVO, de sorte que les données provenant de chaque capteur partagent un système de référence commun. Cette flexibilité signifie que l'outil optimal peut être sélectionné pour contrôler un large éventail de fonctionnalités, sur une seule plate-forme MMT, géré par une interface compatible I++ DME et le logiciel de métrologie MODUS™ de Renishaw.

Du 16 au 21 septembre, les visiteurs pourront assister à la démonstration du nouveau système RFP sur le stand Renishaw du hall 6 lors de l’EMO d’Hannovre 2019.

Pour plus d'informations, consultez [www.renishaw.fr/mmt](http://www.renishaw.fr/mmt).

-Fin-